



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109285492 A

(43)申请公布日 2019.01.29

(21)申请号 201811394415.6

(22)申请日 2018.11.21

(71)申请人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明
大道9-2号

(72)发明人 文殊 温亦谦

(74)专利代理机构 深圳市德力知识产权代理事
务所 44265

代理人 林才桂 鞠骁

(51)Int.Cl.

G09G 3/00(2006.01)

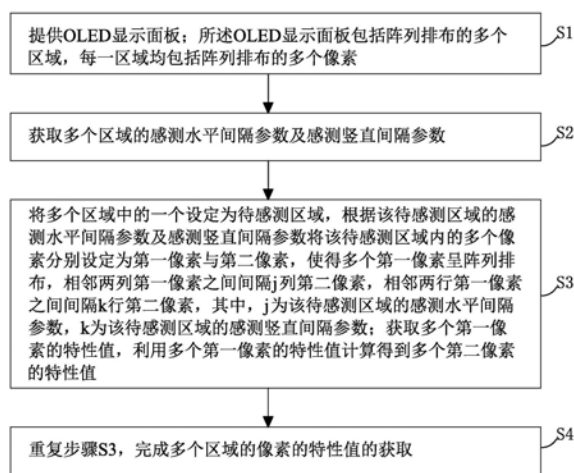
权利要求书2页 说明书6页 附图7页

(54)发明名称

OLED显示面板的像素特性值的感测方法

(57)摘要

本发明提供一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法。本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法先获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,在后续感测过程中,依据每一区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该区域的多个像素分别设定为第一像素与第二像素,并获取多个第一像素的特性值,根据多个第一像素的特性值计算获取多个第二像素的特性值,能够实时感测各像素的特性值,且感测速度快,功耗小。



1. 一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤S1、提供OLED显示面板;所述OLED显示面板包括阵列排布的多个区域(10),每一区域(10)均包括阵列排布的多个像素(101);

步骤S2、获取多个区域(10)的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数;

步骤S3、将多个区域(10)中的一个设定为待感测区域,根据该待感测区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该待感测区域内的多个像素(101)分别设定为第一像素(1011)与第二像素(1012),使得多个第一像素(1011)呈阵列排布,相邻两列第一像素(1011)之间间隔 j 列第二像素(1012),相邻两行第一像素(1011)之间间隔 k 行第二像素(1012),其中, j 为该待感测区域的感测水平间隔参数, k 为该待感测区域的感测竖直间隔参数;获取多个第一像素(1011)的特性值,利用多个第一像素(1011)的特性值计算得到多个第二像素(1012)的特性值;

步骤S4、重复步骤S3,完成多个区域(10)的像素(101)的特性值的获取。

2. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:

步骤S21、感测每一像素(101)的特性值;

步骤S22、将多个区域(10)中的一个设定为待调整区域,将所述待调整区域划分为阵列排布的多个初始子区域(11),每一初始子区域(11)均包括 $k'+1$ 行 $j'+1$ 列像素(101),其中 k' 为预设的初始竖直间隔参数, j' 为预设的初始水平间隔参数,若待调整区域的每一子区域(11)内任意两个像素(101)的特性值的差异值均小于或等于一预设的差值阈值,则将初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,否则对初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数进行调整得到修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数,并将修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数;

所述修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数满足:将待调整区域划分为阵列排布的多个修正子区域(11'),每一修正子区域(11')均包括 $k''+1$ 行 $j''+1$ 列像素(101),其中 k'' 为修正竖直间隔参数, j'' 为修正水平间隔参数,每一修正子区域(11')内任意两个像素(101)的特性值的差异值均小于或等于预设的差值阈值;

步骤S23、重复步骤S22,获取多个区域(10)的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。

3. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,所述步骤S2在所述OLED显示面板的开机阶段进行。

4. 如权利要求2所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,所述步骤S3在所述OLED显示面板的显示帧消隐阶段进行。

5. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,多个区域(10)中的像素(101)数量相同。

6. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,所述步骤S3中,利用多个第一像素(1011)的特性值采用内插的方式计算得到多个第二像素(1012)的特性值。

7. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法,其特征在于,每一像素(101)均包括像素驱动电路;所述像素驱动电路包括第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管

(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第一电容(C1)、有机发光二极管(D1)、第二电容(C2)、运算放大器(U1)及开关(K1)；

所述第一薄膜晶体管(T1)的栅极接入第一控制信号(SW1)，源极接入数据信号电压(Vdata)，漏极电性连接第二薄膜晶体管(T2)的栅极；所述第二薄膜晶体管(T2)的漏极接入电源正电压(OVDD)，源极电性连接有机发光二极管(D1)的阳极；所述第三薄膜晶体管(T3)的栅极电性连接第二控制信号(SW2)，源极电性连接有机发光二极管(D1)的阳极，漏极电性连接运算放大器(U1)的反相输入端；所述第一电容(C1)的两端分别电性连接第二薄膜晶体管(T2)的栅极及源极；所述有机发光二极管(D1)的阴极电性连接电源负电压(OVSS)；所述第二电容(C2)的两端分别电性连接运算放大器(U1)的反相输入端及输出端；所述开关(K1)的控制端接入第三控制信号(SW3)，第一端电性连接运算放大器(U1)的反相输入端，第二端电性连接运算放大器(U1)的输出端；所述运算放大器(U1)的同相输入端接入公共电压(Vcm)，输出端电性连接所述OLED显示面板外部的模数转换器(ADC)。

8. 如权利要求7所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法，其特征在于，每一像素(101)的特性值为该像素(101)的像素驱动电路的第二薄膜晶体管(T2)的阈值电压。

9. 如权利要求7所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法，其特征在于，每一像素(101)的特性值为该像素(101)的像素驱动电路的有机发光二极管(D1)的阈值电压。

10. 如权利要求1所述的OLED显示面板的像素特性值的感测方法，其特征在于，所述步骤S3在获取多个第一像素(1011)的特性值之后还包括对多个第一像素(1011)的像素特性值进行存储的步骤；所述步骤S3在计算得到多个第二像素(1012)的像素特性值之后还包括对多个第二像素(1012)的像素特性值进行存储的步骤；

所述OLED显示面板的像素特性值的感测方法还包括步骤S5、依据多个区域(10)的像素(101)的特性值对数据信号进行补偿并将补偿后的数据信号输入所述OLED显示面板。

OLED显示面板的像素特性值的感测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic Light Emitting Display,OLED)显示装置具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被业界公认为是最有发展潜力的显示装置。OLED显示装置按照驱动方式可以分为无源矩阵型OLED(Passive Matrix OLED, PMOLED)和有源矩阵型OLED(Active Matrix OLED, AMOLED)两大类,即直接寻址和薄膜晶体管(Thin Film Transistor, TFT)矩阵寻址两类。其中,AMOLED具有呈阵列式排布的像素,属于主动显示类型,发光效能高,通常用作高清晰度的大尺寸显示装置。

[0003] AMOLED是电流驱动器件,当有电流流经有机发光二极管时,有机发光二极管发光,且发光亮度由流经有机发光二极管自身的电流决定。大部分已有的集成电路(Integrated Circuit, IC)都只传输电压信号,故AMOLED的像素驱动电路需要完成将电压信号转变为电流信号的任务。

[0004] 如图1所示,现有的一种AMOLED像素驱动电路包括:第一薄膜晶体管T10、第二薄膜晶体管T20、电容C10及有机发光二极管D10。所述第一薄膜晶体管T10的栅极接入扫描信号Gate,源极接入数据信号Data,漏极电性连接第二薄膜晶体管T20的栅极。所述第二薄膜晶体管T20的漏极接入电源正电压OVDD,源极电性连接有机发光二极管D10的阳极。所述电容C10的两端分别电性连接第二薄膜晶体管T20的栅极及源极。所述有机发光二极管D10的阴极接入电源负电压OVSS。工作时,扫描信号Gate控制第一薄膜晶体管T10导通,数据信号Data写入第二薄膜晶体管T20的栅极并对电容C10充电,使得第二薄膜晶体管T20一直处于导通状态,有机发光二极管D10长时间处于直流偏置状态,内部的离子极化形成内建电场,导致有机发光二极管D10的阈值电压不断增大,发光亮度不断降低,长时间发光缩短了有机发光二极管D10的寿命,且不同像素内的有机发光二极管D10的衰老程度不同,使得显示画面亮度不均,影响显示品质。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法,能够实时感测各像素的特性值,且感测速度快,功耗小。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法,包括如下步骤:

[0007] 步骤S1、提供OLED显示面板;所述OLED显示面板包括阵列排布的多个区域,每一区域均包括阵列排布的多个像素;

[0008] 步骤S2、获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数;

[0009] 步骤S3、将多个区域中的一个设定为待感测区域,根据该待感测区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该待感测区域内的多个像素分别设定为第一像素与第二像素,使得多个第一像素呈阵列排布,相邻两列第一像素之间间隔j列第二像素,相邻两行第一像素之间间隔k行第二像素,其中,j为该待感测区域的感测水平间隔参数,k为该待感测区域的感测竖直间隔参数;获取多个第一像素的特性值,利用多个第一像素的特性值计算得到多个第二像素的特性值;

[0010] 步骤S4、重复步骤S3,完成多个区域的像素的特性值的获取。

[0011] 所述步骤S2具体包括:

[0012] 步骤S21、感测每一像素的特性值;

[0013] 步骤S22、将多个区域中的一个设定为待调整区域,将所述待调整区域划分为阵列排布的多个初始子区域,每一初始子区域均包括 $k'+1$ 行 $j'+1$ 列像素,其中 k' 为预设的初始竖直间隔参数, j' 为预设的初始水平间隔参数,若待调整区域的每一子区域内任意两个像素的特性值的差异值均小于或等于一预设的差值阈值,则将初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,否则对初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数进行调整得到修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数,并将修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数;

[0014] 所述修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数满足:将待调整区域划分为阵列排布的多个修正子区域,每一修正子区域均包括 $k''+1$ 行 $j''+1$ 列像素,其中 k'' 为修正竖直间隔参数, j'' 为修正水平间隔参数,每一修正子区域内任意两个像素的特性值的差异值均小于或等于预设的差值阈值;

[0015] 步骤S23、重复步骤S22,获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。

[0016] 所述步骤S2在所述OLED显示面板的开机阶段进行。

[0017] 所述步骤S3在所述OLED显示面板的显示帧消隐阶段进行。

[0018] 多个区域中的像素数量相同。

[0019] 利用多个第一像素的特性值采用内插的方式计算得到多个第二像素的特性值。

[0020] 每一像素均包括像素驱动电路;所述像素驱动电路包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第一电容、有机发光二极管、第二电容、运算放大器及开关;

[0021] 所述第一薄膜晶体管的栅极接入第一控制信号,源极接入数据信号电压,漏极电性连接第二薄膜晶体管的栅极;所述第二薄膜晶体管的漏极接入电源正电压,源极电性连接有机发光二极管的阳极;所述第三薄膜晶体管的栅极电性连接第二控制信号,源极电性连接有机发光二极管的阳极,漏极电性连接运算放大器的反相输入端;所述第一电容的两端分别电性连接第二薄膜晶体管的栅极及源极;所述有机发光二极管的阴极电性连接电源负电压;所述第二电容的两端分别电性连接运算放大器的反相输入端及输出端;所述开关的控制端接入第三控制信号,第一端电性连接运算放大器的反相输入端,第二端电性连接运算放大器的输出端;所述运算放大器的同相输入端接入公共电压,输出端电性连接所述OLED显示面板外部的模数转换器。

[0022] 每一像素的特性值为该像素的像素驱动电路的第二薄膜晶体管的阈值电压。

[0023] 每一像素的特性值为该像素的像素驱动电路的有机发光二极管的阈值电压。

[0024] 所述步骤S3在获取多个第一像素的特性值之后还包括对多个第一像素的像素特性值进行存储的步骤;所述步骤S3在计算得到多个第二像素的像素特性值之后还包括对多个第二像素的像素特性值进行存储的步骤;

[0025] 所述OLED显示面板的像素特性值的感测方法还包括步骤S5、依据多个区域的像素的特性值对数据信号进行补偿并将补偿后的数据信号输入所述OLED显示面板。

[0026] 本发明的有益效果:本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法先获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,在后续感测过程中,依据每一区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该区域的多个像素分别设定为第一像素与第二像素,并获取多个第一像素的特性值,根据多个第一像素的特性值计算获取多个第二像素的特性值,能够实时感测各像素的特性值,且感测速度快,功耗小。

附图说明

[0027] 为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。

[0028] 附图中,

[0029] 图1为现有的AMOLED像素驱动电路的电路图;

[0030] 图2为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法的流程图;

[0031] 图3为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法提供的OLED显示面板的结构示意图;

[0032] 图4为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法提供的OLED显示面板的一个区域结构示意图;

[0033] 图5为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法提供的OLED显示面板的一个像素的像素驱动电路的电路图;

[0034] 图6为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法提供的OLED显示面板的一个像素的像素驱动电路的工作时序图;

[0035] 图7及图8为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法的步骤S2的示意图;

[0036] 图9为本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法的步骤S3的示意图。

具体实施方式

[0037] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。

[0038] 请参阅图2,本发明提供一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法,包括如下步骤:

[0039] 步骤S1、请参阅图3,提供OLED显示面板。所述OLED显示面板包括阵列排布的多个区域10,请参阅图4,每一区域10均包括阵列排布的多个像素101。

[0040] 优选地,多个区域10中的像素101数量相同。

[0041] 具体地,每一像素101均包括像素驱动电路。请参阅图5,所述像素驱动电路包括第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第一电容C1、有机发光二极管D1、第二电容C2、运算放大器U1及开关K1。

[0042] 所述第一薄膜晶体管T1的栅极接入第一控制信号SW1,源极接入数据信号电压Vdata,漏极电性连接第二薄膜晶体管T2的栅极。所述第二薄膜晶体管T2的漏极接入电源正电压OVDD,源极电性连接有机发光二极管D1的阳极;所述第三薄膜晶体管T3的栅极电性连接第二控制信号SW2,源极电性连接有机发光二极管D1的阳极,漏极电性连接运算放大器U1的反相输入端。所述第一电容C1的两端分别电性连接第二薄膜晶体管T2的栅极及源极。所述有机发光二极管D1的阴极电性连接电源负电压OVSS。所述第二电容C2的两端分别电性连接运算放大器U1的反相输入端及输出端。所述开关K1的控制端接入第三控制信号SW3,第一端电性连接运算放大器U1的反相输入端,第二端电性连接运算放大器U1的输出端。所述运算放大器U1的同相输入端接入公共电压Vcm,输出端电性连接所述OLED显示面板外部的模数转换器ADC。

[0043] 进一步地,请结合图5及图6,所述像素驱动电路的工作时序包括第一阶段t1、第二阶段t2及第三阶段t3。在第一阶段t1,第一控制信号SW1为低电位控制第一薄膜晶体管T1截止,第三控制信号SW3为低电位控制开关K1断开,第二控制信号SW2为高电位控制第三薄膜晶体管T3导通,第二薄膜晶体管T2的源极电压被初始化为公共电压Vcm。在第二阶段t2,第一控制信号SW1为高电位控制第一薄膜晶体管T1导通,第二控制信号SW2为高电位控制第三薄膜晶体管T3导通,第三控制信号SW3为低电位控制开关K1断开,数据信号电压Vdata写入第二薄膜晶体管T2的栅极。在第三阶段t3,第一控制信号SW1为低电位控制第一薄膜晶体管T1截止,第二控制信号SW2为高电位控制第三薄膜晶体管T3导通,第三控制信号SW3为高电位控制开关K1导通,第二薄膜晶体管T2的源极电压被抬升,且第二薄膜晶体管T2的源极电压传输至模数转换器ADC,由模数转换器ADC转换后进行锁存。

[0044] 可选地,每一像素101的特性值可以为该像素101的像素驱动电路的第二薄膜晶体管T2的阈值电压。

[0045] 可选地,每一像素101的特性值还可以为该像素101的像素驱动电路的有机发光二极管D1的阈值电压。

[0046] 步骤S2、获取多个区域10的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。

[0047] 具体地,所述步骤2具体包括:

[0048] 步骤S21、感测每一像素101的特性值。

[0049] 步骤S22、将多个区域10中的一个设定为待调整区域,请参阅图7,将所述待调整区域划分为阵列排布的多个初始子区域11,每一初始子区域11均包括 $k'+1$ 行 $j'+1$ 列像素101,其中 k' 为预设的初始竖直间隔参数, j' 为预设的初始水平间隔参数,若待调整区域的每一子区域11内任意两个像素101的特性值的差异值均小于或等于一预设的差值阈值,则将初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,否则对初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数进行调整得到修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数,并将修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数分别作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。

[0050] 所述修正水平间隔参数及修正竖直间隔参数满足:请参阅图8,将待调整区域划分为阵列排布的多个修正子区域11',每一修正子区域11'均包括 $k''+1$ 行 $j''+1$ 列像素101,其中 k'' 为修正竖直间隔参数, j'' 为修正水平间隔参数,每一修正子区域11'内任意两个像素101的特性值的差异值均小于或等于预设的差值阈值。

[0051] 步骤S23、重复步骤S22,获取多个区域10的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。

[0052] 具体地,所述步骤S2在所述OLED显示面板的开机阶段进行。

[0053] 步骤S3、请参阅图9,将多个区域10中的一个设定为待感测区域,根据该待感测区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该待感测区域内的多个像素101分别设定为第一像素1011与第二像素1012,使得多个第一像素1011呈阵列排布,相邻两列第一像素1011之间间隔j列第二像素1012,相邻两行第一像素1011之间间隔k行第二像素1012,其中,j为该待感测区域的感测水平间隔参数,k为该待感测区域的感测竖直间隔参数。获取多个第一像素1011的特性值,利用多个第一像素1011的特性值计算得到多个第二像素1012的特性值。

[0054] 具体地,在图9所示的实施例中,感测水平间隔参数与初始水平间隔参数相等,感测竖直间隔参数与初始竖直间隔参数相等。

[0055] 具体地,所述步骤S3在所述OLED显示面板的显示帧消隐阶段进行。

[0056] 具体地,所述步骤S3中,利用多个第一像素1011的特性值采用内插的方式计算得到多个第二像素1012的特性值。

[0057] 具体地,所述步骤S3在获取多个第一像素1011的特性值之后还包括对多个第一像素1011的像素特性值进行存储的步骤。所述步骤S3在计算得到多个第二像素1012的像素特性值之后还包括对多个第二像素1012的像素特性值进行存储的步骤。

[0058] 步骤S4、重复步骤S3,完成多个区域10的像素101的特性值的获取。

[0059] 步骤S5、依据多个区域10的像素101的特性值对数据信号进行补偿并将补偿后的数据信号输入所述OLED显示面板。

[0060] 需要说明的是,本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法先获取多个区域10的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,具体为在开机阶段先感测每一像素101的特性值,而后将一个区域10设定为待调整区域,根据预设的初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数将待调整区域划分为多个初始子区域11,若初始子区域11中任意两个像素101的特性值差异值均小于或等于预设的差值阈值时将初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,否则调整初始水平间隔参数及初始竖直间隔参数得到修正水平间隔参数及修正竖直参数并作为该待调整区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,重复上述步骤从而得到多个区域10的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数。在后续感测过程中,依据每一区域10的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该区域10的多个像素101分别设定为第一像素1011与第二像素1012,使得多个第一像素1011呈阵列排布,相邻两列第一像素1011之间间隔感测水平间隔参数列的第二像素1012,相邻两行第一像素1011之间间隔感测竖直间隔参数行的第二像素1012,并获取多个第一像素1011的特性值,根据多个第一像素1011的特性值采用内插的方式计算获取多个第二像素1022的特性值,重复上述步骤即可得到多个区域10的像素101的特性值,能够实时感测各像素101的特性值,并且感测时仅需要感测每一区域10内部分像素101的特性值,能够有效降低感测所需的总时长,提升感测速度,且可以减小用于感测的驱动器的功耗。

[0061] 综上所述,本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法先获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数,在后续感测过程中,依据每一区域的感测水平间隔

参数及感测垂直间隔参数将该区域的多个像素分别设定为第一像素与第二像素,并获取多个第一像素的特性值,根据多个第一像素的特性值计算获取多个第二像素的特性值,能够实时感测各像素的特性值,且感测速度快,功耗小。

[0062] 以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

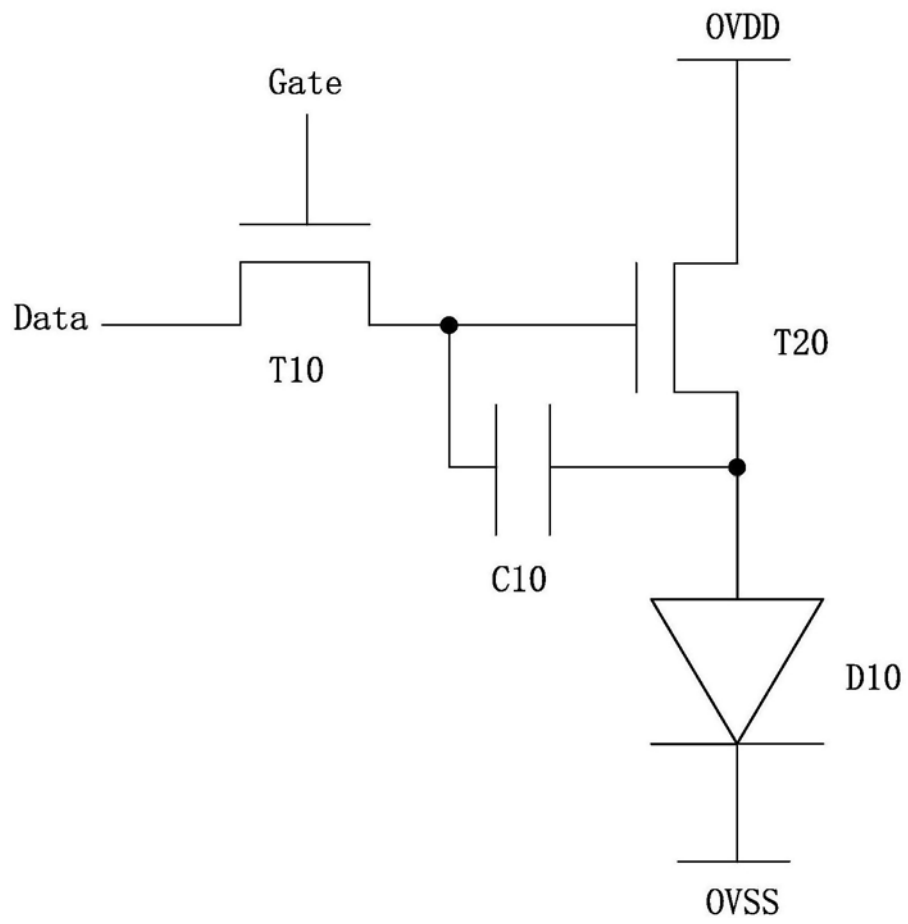


图1

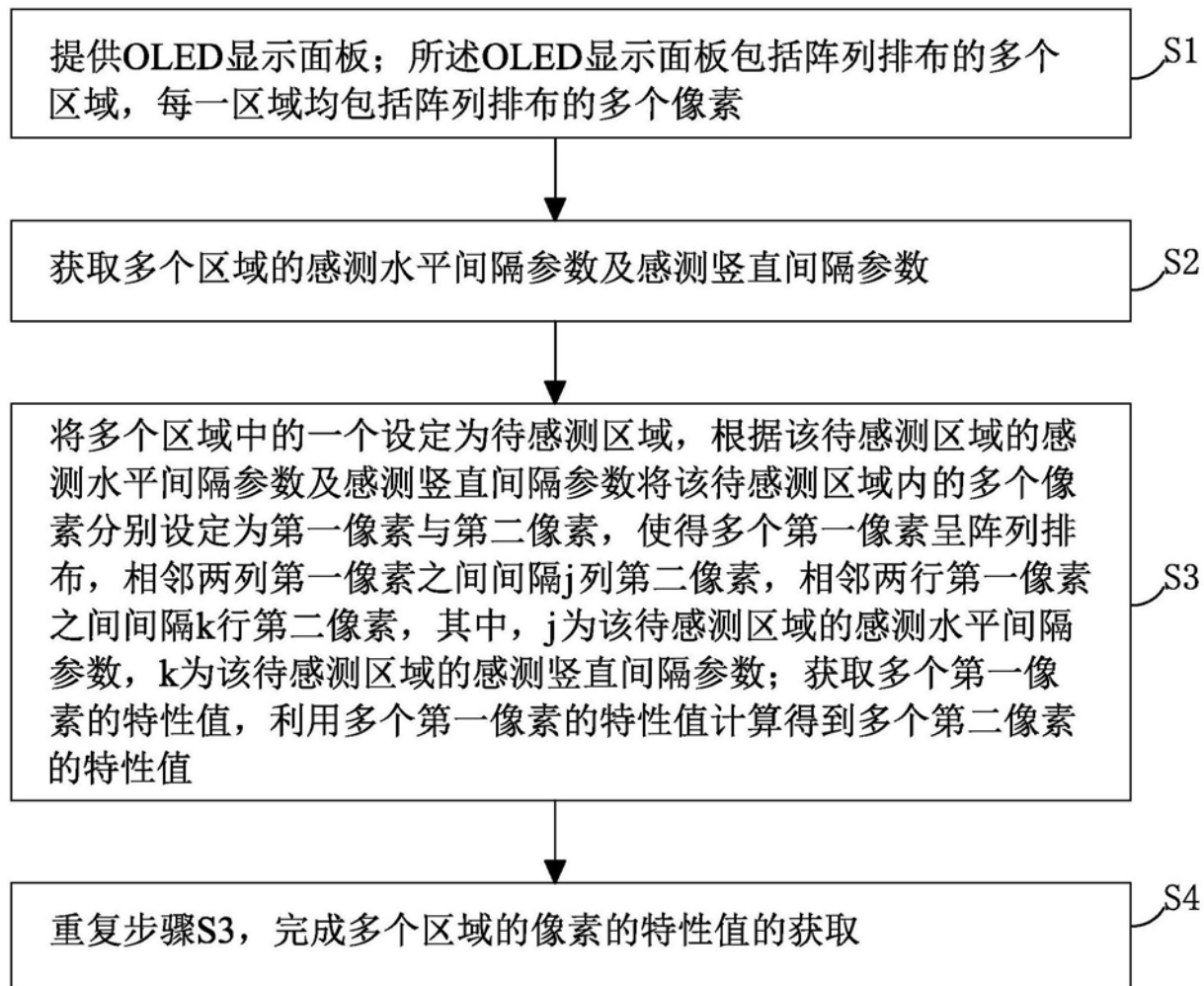


图2

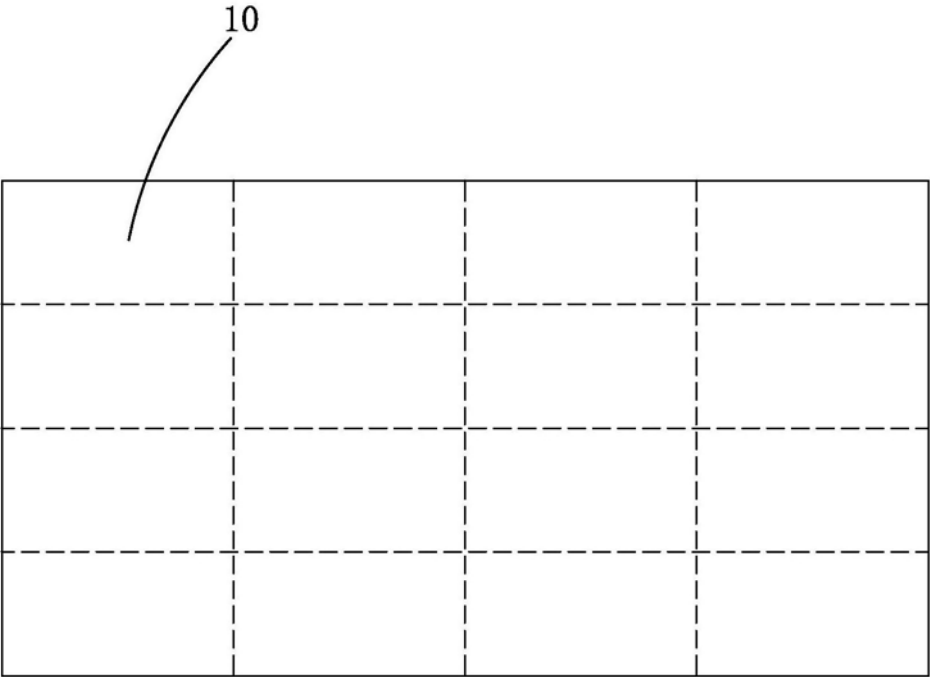


图3

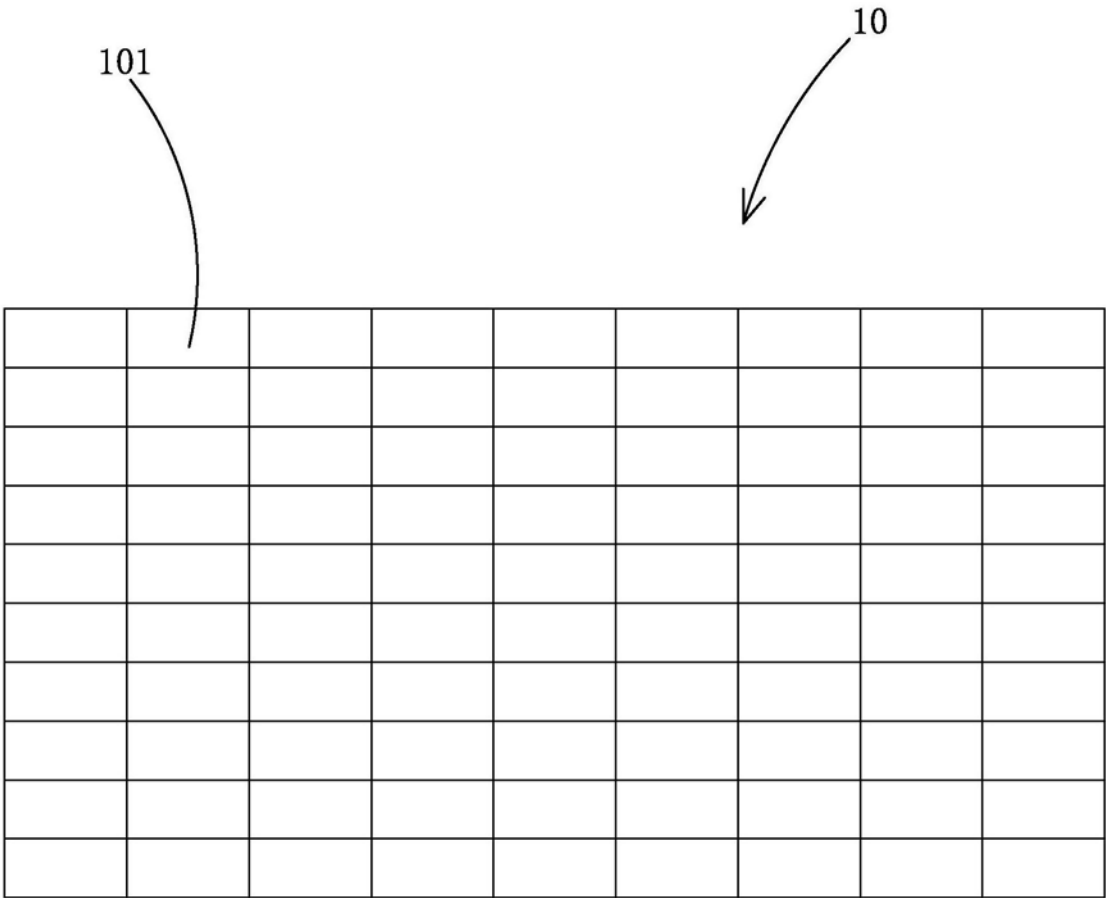


图4

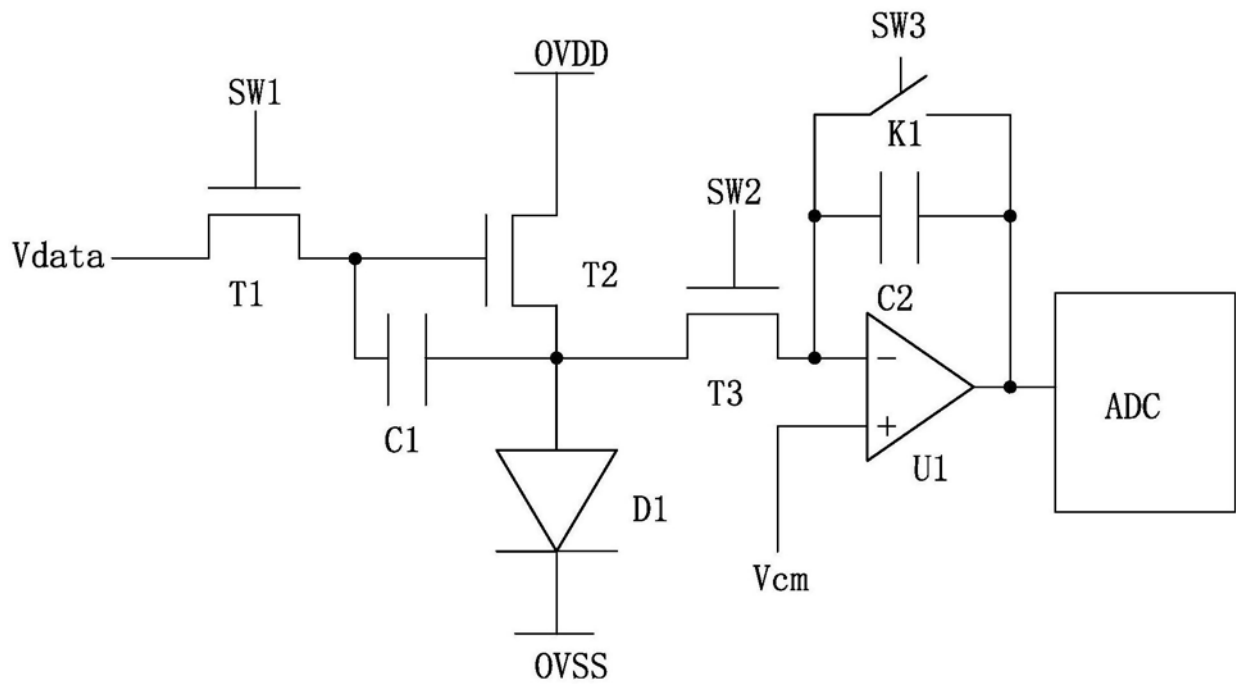


图5

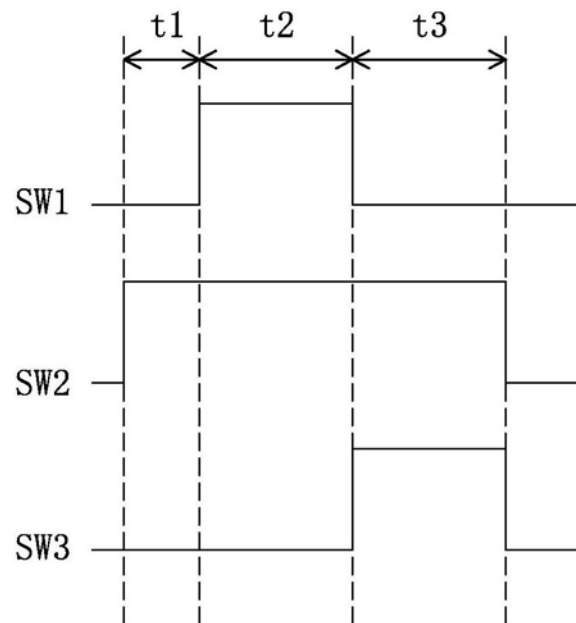


图6

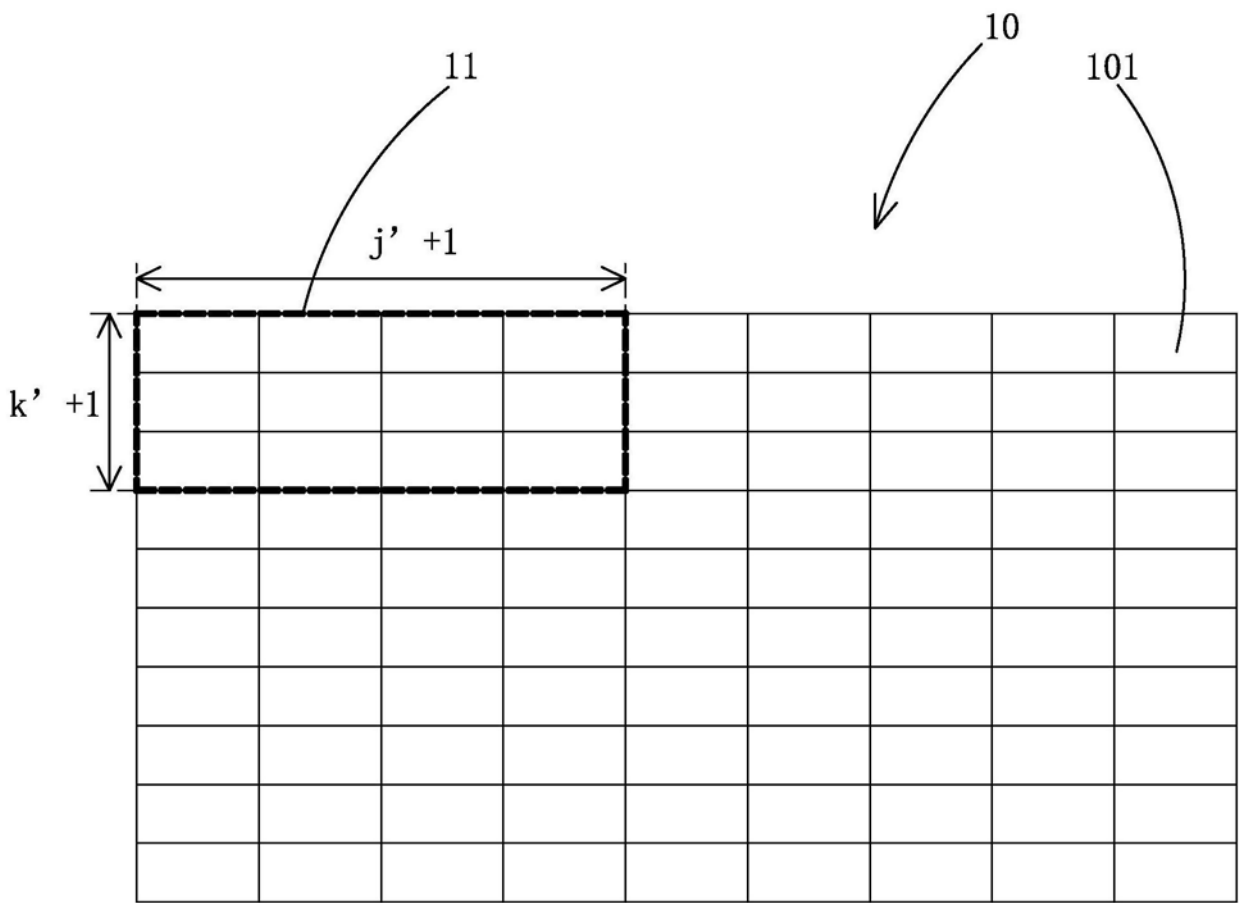


图7

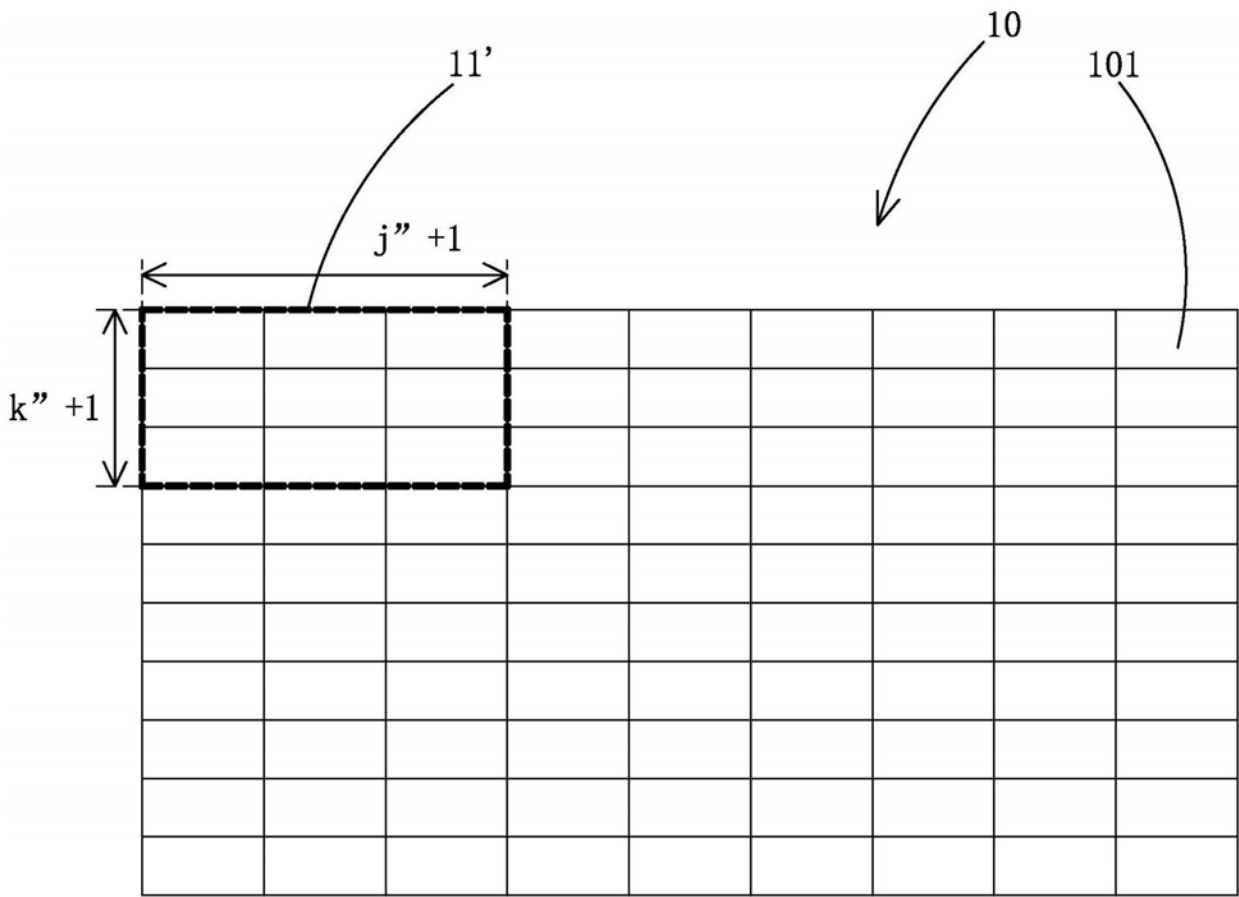


图8

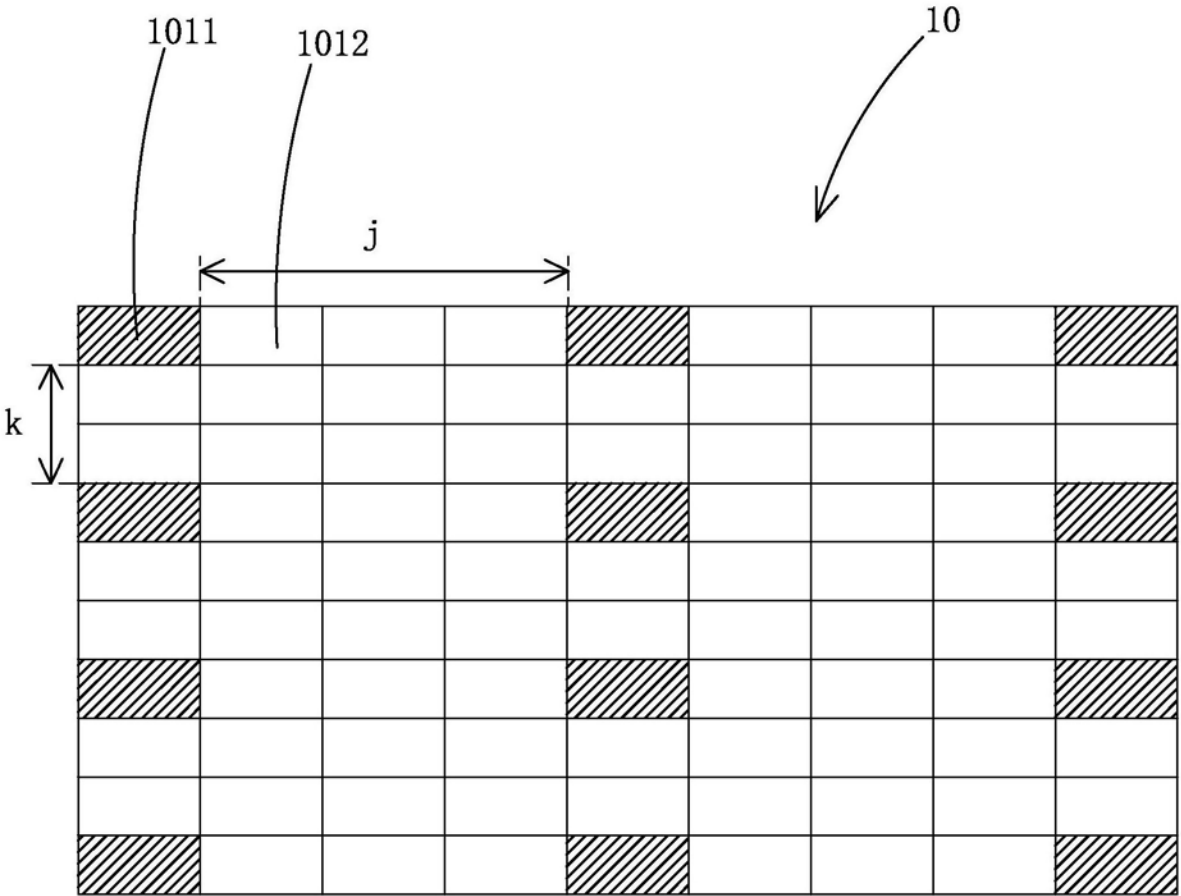


图9

专利名称(译)	OLED显示面板的像素特性值的感测方法		
公开(公告)号	CN109285492A	公开(公告)日	2019-01-29
申请号	CN201811394415.6	申请日	2018-11-21
[标]申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	深圳市华星光电技术有限公司		
[标]发明人	文殊 温亦谦		
发明人	文殊 温亦谦		
IPC分类号	G09G3/00		
CPC分类号	G09G3/006		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种OLED显示面板的像素特性值的感测方法。本发明的OLED显示面板的像素特性值的感测方法先获取多个区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数，在后续感测过程中，依据每一区域的感测水平间隔参数及感测竖直间隔参数将该区域的多个像素分别设定为第一像素与第二像素，并获取多个第一像素的特性值，根据多个第一像素的特性值计算获取多个第二像素的特性值，能够实时感测各像素的特性值，且感测速度快，功耗小。

